UKD 621 382 3 621 317 3

| ELEMENTY PÓŁPRZEWODNIKOWE | NORMA BRANŻOWA | BN-69 3375-08 |
|---|---|---|
| | Elementy półprzewodnikowe **Tranzystory** Metody pomiaru parametrow statycznych | |
| | | Grupa katalogowa VI 99 |

## 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są metody pomiaru parametrów statycznych tranzystorów bipolarnych, obejmujących następujące wielkości:

a) prądy wsteczne,
b) napięcia przebicia,
c) napięcia nasycenia,
d) wzmocnienia prądowe,
e) inne wielkości charakterystyczne.

1.2. Określenia - wg BN-69/3375-04.

1.3. Normy związane

BN-69/3375-04 Elementy półprzewodnikowe. Tranzystory. Podstawowe nazwy, określenia i oznaczenia literowe parametrów

BN-69/3375-07 Elementy półprzewodnikowe. Elektroniczne urządzenia pomiarowe. Wytyczne konstrukcyjne

## 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Urządzenia pomiarowe stosowane do pomiaru parametrów statycznych tranzystorów powinny odpowiadać postanowieniom zawartym w BN-69/3375-07.

2.2. Zabezpieczenie przed wpływami zewnętrznymi. Mierzony tranzystor należy zabezpieczyć przed wpływami zewnętrznych pól elektrycznych i magnetycznych w taki sposób, aby nie wpływały one na wynik pomiaru.

2.3. Temperatura otoczenia w czasie pomiaru powinna być zgodna z temperaturą określoną w normie przedmiotowej na dany typ tranzystora i utrzymywana z dokładnością $\pm 1^{\circ}C$, jeżeli nie określają tego inaczej szczegółowe normy pomiarowe podane w odpowiednich arkuszach.

2.4. Wartości dopuszczalne. W czasie pomiarów nie powinna być przekroczona żadna z dopuszczalnych wartości parametrów eksploatacyjnych tranzystora.

2.5. Pomiar tranzystorow typu n-p-n należy wykonywać przy polaryzacji odwrotnej w stosunku do tranzystora typu p-n-p.

## 3. METODY POMIARU

Metody pomiaru poszczególnych parametrów statycznych tranzystora wg kolejno numerowanych arkuszy.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-69/3375-08

**Normę zredagowano w formie arkuszowej tak, aby metody pomiaru każdego parametru lub grupy parametrów statycznych miały swój oddzielny arkusz.**

**Informacje dodatkowe do każdego arkusza zawierają wykaz wszystkich poprzednio wydanych arkuszy.**

Fabryka Półprzewodników TEWA
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego „UNITRA" dnia 15 grudnia 1969 r jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1970 r
(Mon Pol nr poz )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk Wyd Norm W we Ark wyd 0,12 Nakł 3000+61 Zam 1094/70 Cena zł 1,20